Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/657,488	CHEN, WEI-BIN
Examiner	Art Unit
	

3637

José V. Chen

		<u>:</u>	
	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
16	513	8/3/15	110
	55el		
	53,3		
204	335		,
	386		
		2.0	
		:	

INI	ITERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		<u> </u>	
		i :	
		* *	

(SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
			DATE	EXMR	
Fox g	bæx In len	Cy.	8/3/05	SY	
•		, ·			
:					
:	• •				
:		:			
•		: i			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
:		•			